

**Исследование калибровки системы электромагнитных линз
просвечивающего электронного микроскопа
ThemisZ**

Мартьянова Софья Олеговна

Физический факультет. Электромагнитный практикум. Курсовая работа.

Группа № 19302, 3 семестр, 2020 год.

Научный руководитель:

с. н.с. Герасимов Евгений Юрьевич

Аннотация

Проведено исследование зависимости увеличений просвечивающего электронного микроскопа ThemisZ с использованием специализированного тест-объекта (grating), путем нахождения соотношений реального размера (в нанометрах) к размеру в пикселях. Показано, что во всем диапазоне увеличений наблюдается практически линейная зависимость.

Ключевые слова: микроскопия, просвечивающая микроскопия, электроны, электромагнитные линзы, калибровка микроскопа.